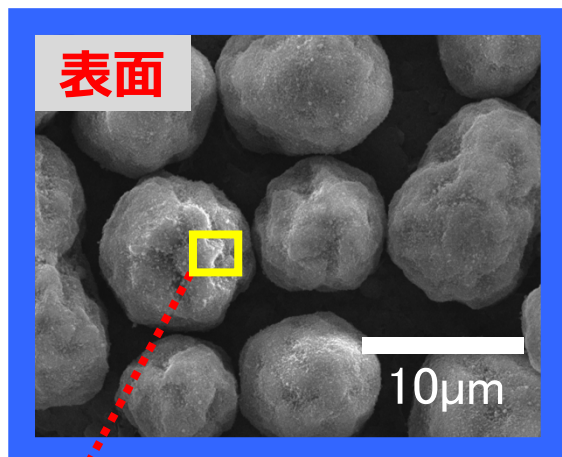
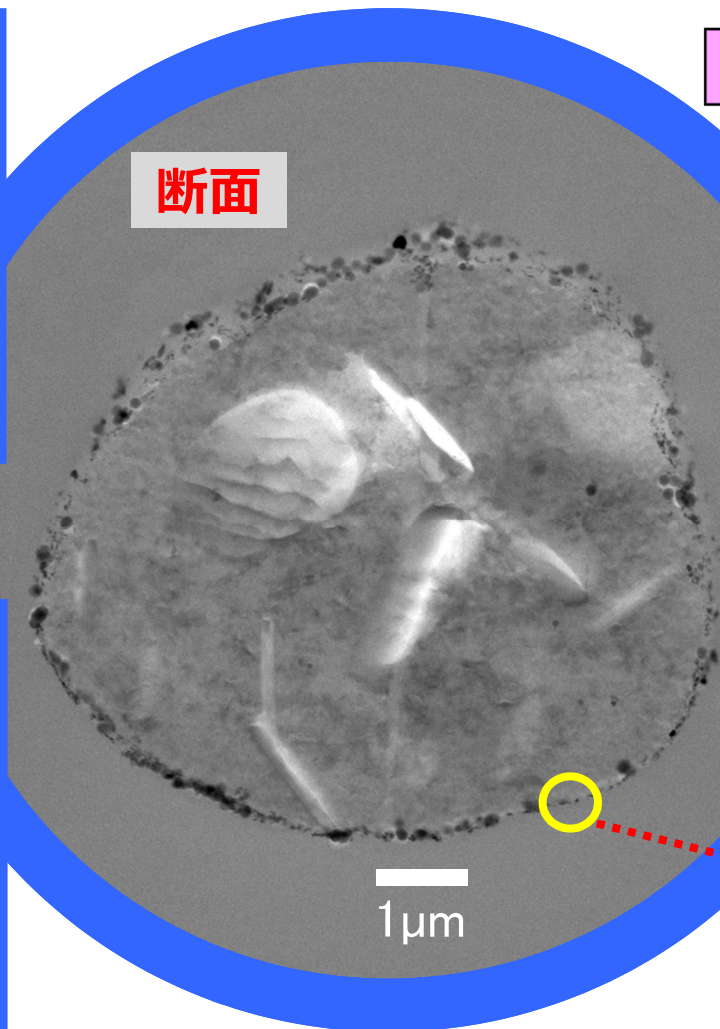
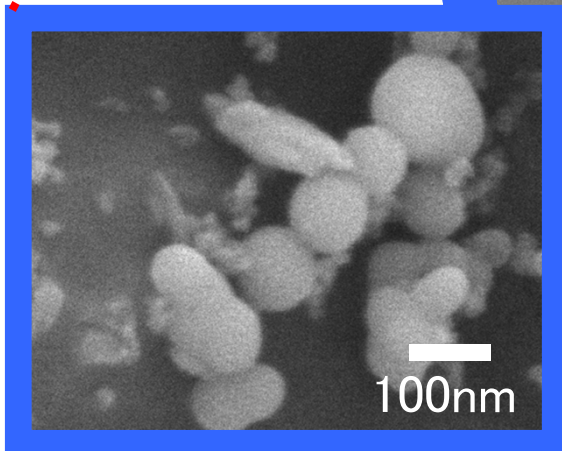


SEM（走査型電子顕微鏡）による観察

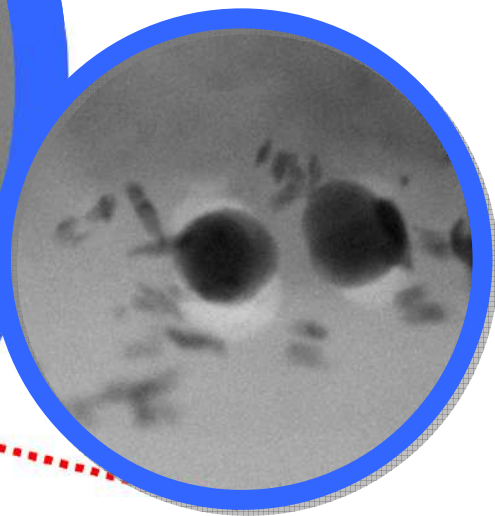
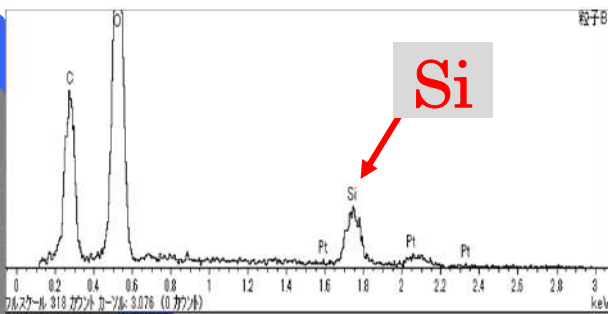
トナーの観察事例



二次電子検出器



エネルギー分散型X線検出器



巴川分析センターは分析力でモノづくりを支援します。いつでもお気軽にお問い合わせください。
TEL:054-256-4163 FAX:054-256-4214 <https://bunseki.tomoegawa.co.jp> E-mail:bunseki@tomoegawa.co.jp